

SECTIONAL FORM SORTING DEVICE

Patent Number: JP8292017
Publication date: 1996-11-05
Inventor(s): KISHIDA TAKAAKI
Applicant(s): TOKAI RIKA CO LTD
Requested Patent: ☐ JP8292017
Application Number: JP19950100853 19950425
Priority Number(s):
IPC Classification: G01B11/24
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To shorten a time for sorting of a sectional form.

CONSTITUTION: A slit ray is projected to a three-dimensional object, from a slit light source in a measuring head 12 of a sectional form sorting device 10, and an optical cutting line of the three-dimensional object is photographed by the TV camera in the measuring head 12. The sectional form sorting device 10 is provided with a measuring circuit 20, a personal computer 22, and a RAM 24, and a video signal of the TV image of the three-dimensional object measured by the measuring head 12 is input to the measuring circuit 20. The signal processed by the measuring circuit 20 is division-processed by a personal computer 22, so as to obtain a scanning line data (j) and picture element coordinates (i) made into a fine line by weighted mean. In a RAM 24, data for form collation consisting of a fixed numeral value is written based on the (j, i) obtained by the personal computer 22 at teaching, the data for form collation is read from the RAM 24 at sorting, and sorting of the sectional form is carried out based on this.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-292017

(43)公開日 平成8年(1996)11月5日

(51)Int.Cl.⁶

G 0 1 B 11/24

識別記号

庁内整理番号

F I

G 0 1 B 11/24

技術表示箇所

A

審査請求 未請求 請求項の数1 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平7-100853

(22)出願日 平成7年(1995)4月25日

(71)出願人 000003551

株式会社東海理化電機製作所

愛知県丹羽郡大口町大字豊田字野田1番地

(72)発明者 岸田 任悟

愛知県丹羽郡大口町大字豊田字野田1番地

株式会社東海理化電機製作所内

(74)代理人 弁理士 中島 淳 (外1名)

(54)【発明の名称】 断面形状選別装置

(57)【要約】

【目的】 断面形状選別時間を短縮する。

【構成】 断面形状選別装置10の測定ヘッド12内のスリット光源からは三次元対象物に向けてスリット光が投光され、測定ヘッド12内のテレビカメラは三次元対象物の光切断線18を撮影する。断面形状選別装置10は測定回路20、パソコン22及びRAM24を備えており、測定回路20には測定ヘッド12で測定した三次元対象物のテレビ画像のビデオ信号が入力される。パソコン22では、測定回路20で処理された信号を割算処理し、走査線データjと、加重平均により細線化された画素座標iを求める。RAM24には、ティーチング時にパソコン22で求めた(j, i)をもとに、所定の数値からなる形状照合用データが書き込まれ、選別時にはRAM24から形状照合用データが読みだされ、これを基に断面形状の選別が行われる。

